

## فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150



فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 محصول شرکت Hitachi کشور ژاپن می باشد . فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 حاوی ضخامت سنج می باشد . طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 یک ضخامت سنج پوشش اشعه ایکس با فلورسنت بالا و مجهز به اپتیک فوکوس پیک پلی کاپیلار و آشکارساز دریافت سیلیکون Vortex است. راندمان تشخیص اشعه ایکس موجب بهبود عملکرد اسپکتروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 میشود و این محصول را قادر می سازد اندازه گیری بالا و دقیق را انجام دهد. علاوه بر این، طراحی جدید برای ایمن سازی فضای گسترده در اطراف موقعیت نمونه، کارایی عالی را به همراه می آورد.

## استفاده آسان و مناسب از فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

درب جدید فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 بگونه ای طراحی شده است که با بازو بسته شدن خود امکان مشاهده نمونه را فراهم می کند و به راحتی قابل تنظیم است. محفظه بسته طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 خطر ریسک نشت x-ray را به حداقل می رساند.

## افزایش دید از نقاط اندازه گیری در اسپکتروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

یک پنجره بزرگ نظارت و تنظیم قطعات، بهینه سازی، دیدگاه موقعیت اندازه گیری را در فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150 بهبود می بخشد در حالی که درب محفظه بسته است.

## پاک کردن تصویر نمونه فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150

دوربین نمونه طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150 با رزولوشن بالا با یک زوم کاملا دیجیتال، تصویر واضح از نمونه را با چندین میکرومتر قطر در موقعیت مشاهده مورد نظر فراهم می کند. واحد روشنایی طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150 برای مشاهده نمونه با استفاده از LED که عمر بسیار طولانی دارد، استفاده می شود.

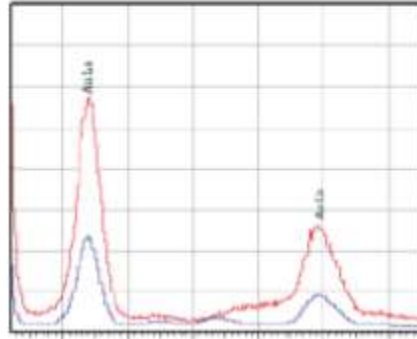
## رابط کاربر گرافیکی جدید در اسپکتروسکوپی فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150

گیرنده اندازه گیری را می توان به سرعت و به آسانی در اسپکتروسکوپی فلورسانس پرتو ایکس XRF مدل FT150 انتخاب کرد. اندازه گیری پنجره Navi هدایت کاربر را از طریق روش های عملیاتی امکان پذیر می سازد.

## ویژگی های فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

- اندازه گیری بسیار دقیق در موقعیت میکرو توسط فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 ، دارای سایز موقعیت تابش از 30 میکرومتر (FWHM:17 $\mu$ m) می باشد . فلورسانس اشعه ایکس دو برابر بیشتر از ابزار معمول اسپکتروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT9500X است. برای برنامه های کاربردی معمول، زمان اندازه گیری برای به دست آوردن دقیق نتایج به نصف کاهش می یابد.



حساسیت بهبود یافته (تصویر طیفی از Au)

### کاربرد فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

- فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150 برای اندازه گیری یک فیلم فوق العاده نازک و نقاط کوچک قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد .
- طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150L برای اندازه گیری مدار چاپی بزرگ 600mm x 600mm استفاده می شود .
- اسپکتروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150H برای اندازه گیری همزمان پوشش های Sn/Ni مورد استفاده قرار می گیرد .

### آپشن های فنی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

- نرم افزار مطابق با طیف (شناسه مواد)
- FP فله (نسبت مولتی مولیپیک)
- محدودیت عملیات مرحله
- نگهدارنده ویفر (FT150 / FT150h)
- مانیتور لمسی
- برج سیگنال
- چاپگر

مشخصات فنی فلورسانس اشعه ایکس XRF مدل FT150

FT150L	FT150h	FT150	
Atomic No. 13(Al) to 92(U)	Atomic No. 13(Al) to 92(U)	Atomic No. 13(Al) to 92(U)	عناصر فلورسانس اشعه ایکس XRF
Tube voltage: 45kV Mo target	Tube voltage: 45kV W target	Tube voltage: 45kV Mo target	منبه فلورسانس پرتو ایکس XRF
SDD detector (No LN2 required)	SDD detector (No LN2 required)	SDD detector (No LN2 required)	اشکارساز فلٹوورسانس اشعه ایکس XRF
Polycapillary	Polycapillary	Polycapillary	سیستم اپٹیک فوکوس فلٹوورسانس پرتو ایکس XRF
CCD camera (1 million pixels)	CCD camera (1 million pixels)	CCD camera (1 million pixels)	مشاہدہ نمونہ طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF
Laser focus, auto focus	Laser focus, auto focus	Laser focus, auto focus	تنظیمات فوکوس طیف سنجی فلٹوورسانس اشعه ایکس XRF
600(W)×600(D)×20(H) mm	400(W)×300(D)×100(H) mm	400(W)×300(D)×100(H) mm	بیشترین سائز نمونہ اسپیکٹروسکوپی فلورسانس اشعه ایکس XRF
300(W)×300(D)mm	400(W)×300(D)mm	400(W)×300(D)mm	ابعاد محفوظہ نمونہ قابل حمل اسپیکٹروسکوپی فلٹوورسانس اشعه ایکس XRF
Personal computer with 22- inch LCD Monitor	Personal computer with 22- inch LCD Monitor	Personal computer with 22- inch LCD Monitor	کنٹرلر فلورسانس پرتو ایکس XRF
Thin film FP (Max 5 layers, 10 elements), Thin film Calibration curve method, Qualitative analysis	Thin film FP (Max 5 layers, 10 elements), Thin film Calibration curve method, Qualitative analysis	Thin film FP (Max 5 layers, 10 elements), Thin film Calibration curve method, Qualitative analysis	نرم افزار اندازہ گیری فلٹوورسانس پرتو ایکس XRF
Microsoft Excel, Microsoft Word	Microsoft Excel, Microsoft Word	Microsoft Excel, Microsoft Word	پردازش داده ها طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF
Interlocked chamber door	Interlocked chamber door	Interlocked chamber door	عملکرد آسان طیف سنجی فلٹوورسانس پرتو ایکس XRF
Less than 300VA	Less than 300VA	Less than 300VA	برق مصرفی اسپیکٹروسکوپی فلورسانس پرتو ایکس XRF